

中性子反射率法による薄膜の界面構造解析

武田 全康*

Structural Analysis of Interfaces in Thin Films Using Neutron Reflectometry

Masayasu TAKEDA*

* 日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研究部門 (〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4)

*Quantum Beam Directorate, Japan Atomic Energy Agency (2-4 Shirane, Shirakata, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki 319-1195)